SICK.COM



技術資料

Nova Ruler3000

SICK Nova
應用軟體

SICK Sensor Intelligence

應用軟體

Nova Ruler3000

訂購資訊

型號	貨號
Nova Ruler3000	應要求提供

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/SICK_Nova

詳細技術資料

特徵

描述	SensorApp Nova Ruler3000與配合3D串流攝影機Ruler3000使用的SIM2x00產品系列的裝置相容。為了能夠使用此應用程式，需要有Quality Inspection License。 Quality Inspection Toolset用於保證產品完成生產後完全符合具體要求，諸如尺寸和成分。
任務	檢測 - 標準對象 檢測 - 液位 量測 - 尺寸、輪廓與體積 監測與控制 - 品質 識別 - 圖案 識別 - 分揀 確定位置 - 二維位置測定 確定位置 - 三維位置測定
技術	3D雷射三角量測法, 圖像分析

產品類別	可程式化, 可配置
SICK Nova工具組	
Quality Inspection License	AI Circular OCR Pretrained (2D, 3D) AI OCR Pretrained (2D, 3D) 角鋼 面积 斑點分析儀 Blob查找器 (2D, 3D) 斑点定位器 (2D) 斑点区域查找器 斑点验证器 盒子查找器 一维码 DPM (2D) 二维码 DPM (2D) 完整性檢查 距离 (2D, 3D) 边缘像素计数器 (2D) 特徵定位器 (2D, 3D) 線條 线识别 最小/最大 缺失数据过滤器 形态学滤波器 (2D, 3D) 降噪过滤器 (2D, 3D) 目标定位器 (2D, 3D) 像素计数器 (2D) 平面 平面拟合 點 位置檢查 (2D) 探针高度 圆识别 表面拟合 體積 AI异常检测 (2D, 2小時測試階段) AI異常檢測（dStudio） (2D, 2小時測試階段) AI Blob查找器（dStudio） (2D, 2小時測試階段) AI分級 (2D, 2小時測試階段) AI分級（dStudio） (2D, 2小時測試階段) AI物體檢測 (2D, 2小時測試階段)
Intelligent Inspection License	AI异常检测 (2D) AI異常檢測（dStudio） AI Blob查找器（dStudio） (2D) AI分級 (2D) AI分級（dStudio） (2D) AI物體檢測 (2D) AI物體檢測（dStudio） (2D)
擴展選項	可透過SICK Nova工具插件添加依據客戶要求制定的工具或全新工具。由SICK AppSpace和SICK AppStudio支援工具的研發和調整。
語言	德文, 英文, 法文, 義大利文, 西班牙文, 日文, 韓語, 中文
文件	操作說明
支援的產品	SIM2x00 + Ruler3000

系統要求

Firmware	參見相應SensorApp版本的版本說明或AppPool
最低螢幕解析度	512 px x 424 px
支援瀏覽器	Google Chrome（80或更高版本）
安裝工具	SICK AppManager License Manager SensorApp（用於啟動裝置上的使用授權）

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/SICK Nova

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence